

ББК 22.31

Ф37

УДК 535.33

Фелдман Л., Майер Д.

Ф37 Основы анализа поверхности и тонких пленок: Пер. с англ. — М.: Мир, 1989. — 344 с., ил.

ISBN 5-03-001017-3

Монография, написанная известными американскими специалистами в области атомных столкновений в твердых телах, посвящена физическим основам и методам использования пучков ионов, электронов и рентгеновского излучения для анализа структуры и состава тонких пленок вещества. Эти методы играют важную роль в развитии современной атомной технологии, особенно в области микроэлектроники. Все вопросы изложены на высоком научном уровне.

Для специалистов, интересующихся проблемами анализа поверхности и тонких пленок, аспирантов и студентов.

Ф 1604110000—289 56—89
041 (01)—89

ББК 22.31

Редакция литературы по физике и астрономии

ISBN 5-03-001017-3 (русск.)

ISBN 0-444-00989-2 (англ.)

© 1986 by Elsevier Science Publishing
Co, Inc.

© перевод на русский язык, «Мир»,
1989